文章编号 1674-2915(2011) 05-0453-08

两种高速 CMOS 图像传感器的应用与测试

孙宏海 刘艳滢

(中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所 吉林 长春 130033)

摘要:采用 MI-MV13 和 LUPA-I300-2 两种不同厂家型号的高速 CMOS 图像传感器,设计了分辨率为1 280 ×1 024 的 300 ~500 frame/s 高速数字工业相机,并在实验室条件下对设计相机进行了关键性能指标对比测试,得到了光谱响应及 量子效率、增益、动态范围、暗电流、读出噪声、光电响应非均匀性等测试结果。测试分析显示,LUPA-I300-2 的峰值量子 效率为 50% ,比 MI-MV13 的峰值量子效率高 12% ,与厂家的参考指标基本一致。测试结果证明: 该测试方法正确,对两 种高速 CMOS 图像传感器的关键性能指标的测试客观可信,所设计的高速 CMOS 摄像机的性能基本满足高帧频摄像的 要求。

关 键 词:高帧频 CMOS 图像传感器;量子效率;暗电流;光电响应;非均匀性中图分类号:TB853.1; TN386.1 文献标识码:A

Application and test of two different high-speed digital CMOS image sensors

SUN Hong-hai , LIU Yan-ying

(Changchun Institute of Optics Fine Mechanics and Physics Chinese Academy of Sciences Changchun 130033 China)

Abstract: Two kinds of high-speed industrial digital cameras with a resolution of $1\ 280 \times 1\ 024$ and a high frame rate of 300 - 500 frame/s were designed based on two different models of high frame rate CMOS imaging sensors from two different CMOS sensor manufacturers. The CMOS image sensors are MI-MV13 and LUPA 1300-2. Some experiments of imaging performance evaluation by a laboratorial test were presented. Spectral response and quantum efficiency (QE), gain, photoelectric conversion nonlinearity, dark-current, readout noise, full well electron quantity, dynamic range, *etc.* were tested and analyzed. Experimental results show that the LUPA 1300-2 is superior to MI-MV13 at quantum efficiency testing, and their peak value QEs are 50% and 12%, respectively, which is basically the same as the reference data of manufacturers. The test re-

基金项目:中国科学院三期创新工程基金资助项目(No. 060Y32T060)

收稿日期:2011-07-11;修订日期:2011-08-13

sults prove that proposed test method is correct and the evalution for two high-speed CMOS image sensors is objective and credible. The high-speed CMOS cameras designed can satisfy the system performance requirements for a high-frame rate.

Key words: high frame rate CMOS image sensor; Quantum Efficiency(QE); dark signal; photo response; nonuniformity

1 引 言

近年来,随着 CMOS 图像传感器的快速发展, 高帧频相机被广泛应用于工业自动化控制、科学 研究和国防技术等领域,在高速瞬间变化场景的 捕获和成像记录中发挥着重要作用,尤其以 CMOS 图像传感器为光电转换元件的新一代的高 速数字摄像机,由于具有低功耗、小体积、高可靠、 高集成、低成本、宽动态范围、AOI 功能、拍摄时间 长和无拖影等诸多优点,其优势更为显著。

CMOS 图像传感器采用高速 CMOS 半导体集 成电路工艺制作,具有像素单元独立的转移读出 结构、内部集成多路高速 AD 并行转换器、全局同 步电子快门、高速数字接口输出等特点,十分适合 高帧频成像和高速数字像元数据的高速输出。经 过不断设计优化,其 APS 像元结构的 CMOS 图像 传感器的噪声问题已经得到改善;而多晶体管像 元结构、数字像元结构和背照射光子积分方式等 新技术的采用,使得 CMOS 图像传感器的灵敏度 和动态范围都有很大的提高,但 CMOS 图像传感 器的成像性能仍然是人们所关注的焦点。

CMOS 图像传感器的成像性能参数一般可以 由生产厂家在设计生产时进行评估测定,给出其 性能参数的典型值。有时候由于生产工艺和半导 体材料的变化等原因,使得该典型值并不能真实 地代表用户使用图像传感器的真实性能参数。另 外,不同厂家的测试方法和评价标准并不完全一 致,在进行对比评价时可能会由于采用的测试方 法和参数量纲不相同,无法进行对比评价。因此, 相机设计后需要通过对 CMOS 图像传感器特定条 件输出的图像进行分析计算,得到该图像传感器 的测试条件下的关键性能指标,如灵敏度、满阱电 荷数、读出噪声、光电响应非均匀性、增益及暗电 流等^[1-6]。

本文应用了两种不同厂家的高速 CMOS 图像 传感器进行高帧频数字相机系统设计,并在光电 辐射测量实验室中,对关键性能参数的进行测试, 最终给出了测试数据对比分析结果。实验测试客 观地证明了采用两种不同高速 CMOS 图像传感器 的相机成像性能。

2 两种 CMOS 图像传感器介绍

随着半导体制造工艺和固体成像器件相关技术的不断发展,高分辨率高帧频的 CMOS 图像传感器不断出现,目前已经有1 600 ×1 200 @ 1 000 frame/s的高速 CMOS 图像传感器间世。但很多高帧频 CMOS 图像传感器都是为特定的高帧频相机设计开发的,并非商业化销售。本文选取的 Micron 公司的 MI-MV13 和 Cypress 公司的 LU-PA-1300-2 两种图像传感器是目前的商业款高帧频 CMOS 图像传感器,在同类图像传感器选择中具有一定的代表性和对比性。具体的参数见表1。

MI-MV13 与 LUPA-1300-2 高速 CMOS 图像 传感器具有相同的分辨率 1 280 × 1 024 ,共 1.3 × 10⁶ pixel ,都具有能够达到 500 frame/s 的全幅图 像输出能力 ,但二者的像元结构和内部成像读出 结构不完全相同。如图 1(a) 所示 ,MI-MV13 内部 结构主要包括感光像元阵列、列向 AD、AD 寄存 器、输出寄存器和内部时序生成模块 ,其片内集

表1 两种 CMOS 图像传感器参数对比^[78]

Tab.1 Performance comparison of two models of CMOS image sensors

2 **	指标			
参数	MI-MV13	LUPA-1300-2		
	1 280 \times 1 024(SXGA resolution)	1 280 × 1 024(SXGA resolution)		
像元尺寸(μm × μm)	12.0×12.0	14.0×14.0		
像元结构(晶体管数量)	4T	6T		
传感器感光面积/mm	H: 15.36, V: 12.29, Diagonal: 19.67	H: 17.92, V: 14.34, Diagonal: 22.95		
最大帧频/fps@SVGA	500	500		
像元输出速率	10 bit × 10 Column Parallel	On-chip 10-bit ADCs × 12 Column Parallel		
	Channels@66 MHz System	Channels @ Master Clock 310 MHz		
	Clock(660 MBytes/s)	(12 LVDS serial outputs@620 Mb/s)		
填充因子	40%	40% (Peak QE × FF)		
饱和满阱电荷数	63 000 e ⁻	30 000 e ⁻		
量子效率	Max 27% (525 nm)	$\rm QE \times FF$ 35% (average 400 ~ 720 nm)		
内部动态范围/dB	59	57.81		
输出暗电流/(mV/s@ 21 ℃)	50	200		
响应度	Monochrome: 1 600	4 000 LSB/lux-sec		
	LSB/lux-sec@550 nm; ADC reference@1 V	7 639 V/(J/m ²) @ 680 nm		
电荷转换增益/(μV/e⁻)	13	34		
读出噪声/e⁻	70	37		
响应非均匀性	0.6% RMS	1% RMS		
固定模式噪声	5% RMS	2% RMS		
快门类型	TrueSNAP freeze-frame electronic shutter	Pipelined & Triggered Global Shutte		
快门曝光时间	2 µs to 33 ms	10 µs to 1 s		
功耗/mW@500 frame/s	< 500	1 250		



图 1 两种 CMOS 图像传感器内部结构框图



成了 10 路 10 bit ADCs ,ADC 的时钟和像素的读 出控制时钟完全片内集成 ,有自校准功能 ,最高输 入输出时钟为 66 MHz ,10 路 10 bit 的高速 CMOS 数字输出接口和开放式驱动结构设计 ,使得对传 感器内部的操作更为灵活。图 1(b)为 LUPA-1300-2 图像传感器内部结构框图 ,可以看出其与 MI-MV13 的区别 ,内部驱动信号主要由外部 SPI 总线进行驱动参数设置和输入驱动时钟 ,内部集 成 24 路 10 bit 高速 AD 转换器 ,同时进行模数转 换 ,得到的 24 路像元数字信号经过二倍频后 ,由 12 路每路带宽 620 Mb/s 的 LVDS 高速串行发送 器将高速图像数据发送出 CMOS 图像传感器。

3 测试相机应用设计

本文中应用 MI-MV13 和 LUPA-1300-2 两款 图像传感器,分别设计开发出两个型号的高帧频 CMOS 数字相机,HD300(MI-MV13)和 HD500 (LUPA-1300-2)。两台相机的系统设计原理基本 相同,主要包括:成像单元(高帧频 CMOS 图像传 感器),FPGA 时序生成单元,MCU 微控制器单元, 输入输出接口部分。各组成部分的结构总线关系 如图 2 所示。FPGA 作为 CMOS 图像传感器的主 要控制单元,同时将高速图像数据进行采集、格式 转换后由高速图像数据传输接口(CameraLink 接 口)输出。相机控制数据由串口发送到相机内部 的微控制器,微控制器接收到工作参数命令后,对





Fig. 2 Block diagram of CMOS digital camera with high frame rate

CMOS 图像传感器、FPGA 内部寄存器和相关外设进行上电初始化,然后高速相机按照设定参数进行积分成像。

4 主要性能指标及测试方法

下面对相机的主要测试指标的定义和测试方 法进行简单介绍^[946]:

(1)探测器的灵敏度表征参数为光响应度, 或者量子效率,本文采用量子效率。量子效率定 义为探测器读出的光电子数与入射探测器表面的 光子数之比。

测量方法:采用光子定标标准方法,即利用绝 对定标光电探头作为标准,对入射 CMOS 的光场 强度进行定标测量,然后计算 CMOS 的量子效率。 具体方法是利用单色光源,测量入射到器件表面 的单色光束强度,器件在该波长的量子效率为:

η(*I*/e) /(*P*/*hv*), (1) 其中:η为量子效率 / 为由读出值得到的光生电 流值 e 为电子电量 / P 为入射光功率 *hv* 为光子 能量。

(2) 增益: 定义为一个模数转换单位(ADU)也就是读出的一个数字单位对应的原始光生电子数。

测量方法:增益测量方法有软 X 射线同位素 检测法和所谓的"光子转移技术"方法。由于两 台待测 CMOS 封装模块在芯片上均加有封窗,X 射线光子不能穿透封窗材料,因此软 X 射线同位 素检测法不可行,只能采用光子转移技术方法。 光子转移技术方法的测量原理基于信号强度与噪 声之间的关系。

(3)读出噪声:与信号强度无关,是所有读出 图像中所附加的探测器本身造成的噪声,即噪声 基底,通常用读出噪声这一指标来评估器件的噪 声水平。

测量方法:计算多幅零曝光图像的标准差,并 取平均值。

(4) 暗电流: 单位时间内一个像元内产生的 热电子数量。

测量方法:测量暗电流时,首先获得多幅零曝

光图像,进行平均后得到剔除图像本底 BIAS,然 后将 CMOS 挡光以保证在积分和读出过程中没有 可产生光电子的光子到达 CMOS 光敏区,再设置 系统的积分时间 T(单位为 s),以保证暗流电子 不至于使像元势阱饱和。这时像元读出值为 N (单位为 ADU),则该像元的暗流值(其中包括了 噪声,主要为读出噪声和暗流噪声)为:

$$I = \frac{N - BIAS}{T} \bullet G . \tag{2}$$

实际测量中,为提高测量精度,采用多个积分时间T,并作线性拟合,其斜率即为暗电流值。

(5) 动态范围定义为探测器的满阱电荷与读 出噪声的比。

$$DR = 20\log \frac{N_{\text{sat}}}{N_{\text{readout rms}}} \text{[dB]}.$$
 (3)

测量方法:本方案采用两种方法来表征,一种 是给出该 CMOS 相机的线性曲线;另一种是按照 动态范围的定义计算数值,即分别测量获得该 CMOS 相机的满阱电荷和读出噪声。

(6) 固定图案噪声(FPN): CMOS 器件固有的 像素间非均匀性噪声。

测试方法:在挡光情况下,获得多幅最小积分 时间图像,累加平均,计算得到该平均帧图像的标 准差,即为固定图案噪声。

(7) 光响应非均匀性(PRNU):一个用来表征 离散探测器件各光敏元响应的不一致性的参数。 测量方法是:在 50% 满阱的均匀光照下获得光响 应非均匀性图像 10 frame 以上,经 FPN 和 DSNU 去除改正后,累加平均,计算得到该平均帧图像的 标准差,即为该 CMOS 相机的光响应非均匀性。

5 测试结果与分析

相机辐照性能检测平台如图 3 所示,由光源 驱动器产生照射光源,经过滤光片进行波段分光 后进入积分球内,在积分球内产生的均匀辐照光 线,经过出光口照射到被测相机的 CMOS 图像传 感器的靶面上感光,均匀照射光线的辐照强度可 以由标准光电探头测量得到。被测相机在主控计 算机的采集控制下得到测量图像,由计算机内的 采集卡采集存储到计算机中,之后对采集特定条 件下的图像数据进行计算,得到最终测试结果。 图 4 为相机辐照性能检测暗室的实际测试环境照 片。



图 3 相机辐照性能检测平台

Fig. 3 Experiment platform of camera irradiation performance



图 4 相机辐照性能检测暗室 Fig. 4 Darkroom of camera irradiation performance

图 5(a)为 MI-MV13 量子效率光谱响应曲线 对比测试图。从实际相机测试得到的量子效率曲 线可以看出,在 400~1 100 nm 的响应趋势与厂 家测试结果基本一致,量子效率最高的波长在 500 nm 附近,但是,量子效率的整体低于厂家的 指标,分析可能是厂家的量子效率没有考虑到填 充因子的影响。

图 5(b)为 LUPA-1300-2 的量子效率光谱响 应曲线对比测试图,从实际相机测试得到的量子 效率曲线可以看出,在 400~1 100 nm 的响应趋 势与厂家测试结果基本一致,量子效率峰值响应 波长在 650 nm 附近,但是量子效率的整体略高于 厂家的指标。实测相机的峰值量子效率达到 50%,厂家的峰值量子效率为 40%。 图 6 为 MI-MV13 光电响应线性曲线和暗电 流响应曲线,其光电响应的线性度较好.暗电流也 是随积分时间线性增加,但是当积分时间大于 80 ms后暗电流出现了很大增长,所以 MI-MV13 不适合长时间的低帧频成像。从两条曲线线性段 的斜率可以看出 MI-MV13 的光电响应效率略低, 但其暗电流的响应也很低。





Fig. 5 Comparison curves of quantum efficiency spectral responses for two CMOS image sensors



图 6 MI-MV13 光电响应线性曲线和暗电流响应曲线

Fig. 6 Linear optical response curve and dark current response curve of MI-MV13 testing

图 7 为 LUPA-1300-2 光电响应线性曲线和暗 电流响应曲线,可以看出其光电响应的线性度较 差,当积分到 70% 饱和灰度时,开始出现响应度 降低。可以看出暗电流基本是随积分时间线性增 加,但是暗电流较为严重,当积分 40 ms 时暗电流 就会使像元积分饱和。分析 LUPA-1300-2 的暗电 流严重的原因和其像元采用 6T 结构有关,增加的 放大晶体管使得整个芯片功耗增加,工作温度达 50 ℃以上,并且 6T 结构也把暗电流和噪声进行 了放大。因此,LUPA-1300-2 不是非常适合低帧 频的长时间积分成像。

最终测试得到的两台测试相机的成像指标, 见表2。对比分析可以看出,LUPA-1300-2的成像 性能在读出噪声,动态范围和量子效率等指标优 于 MI-MV13; MI-MV13 在暗电流、光电响应非均 匀性和固定模式噪声3 个性能指标上优于 LUPA-1300-2。综上所述,LUPA-1300-2 有较高的灵敏 度 在高帧频短积分时间成像时可以得到更好的 成像质量。



图 7 LUPA-1300-2 光电响应线性曲线和暗电流响应曲线

Fig. 7 Linear optical response curve and dark current response curve of LUPA-1300-2 testing

	表 2	测讯相机	指你对比		
Tab. 2	Comparison	of testing	results for	two	cameras

	HD300(MI-MV13)	HD500(LUPA-1300-2)
增益/(e ⁻ /ADU)	295	180
读出噪声/e⁻	133	36
满阱电荷/e⁻	73 800	45 100
动态范围	550:1(54.8 dB)	1 260:1(62 dB)
峰值量子效率	12% @ 500 nm	50% @ 650 nm
暗电流(e ⁻ /pixel • ms ⁻¹)	21.87(约35°C)	442(约55℃)
FPN 标准差值(校正后)	5.1(4.85% RMS)	6.064(5% RMS) /3.121(3.63% RMS)
PRNU 标准差值(校正后)	2.1(0.85% RMS)	3.642(1.47% RMS) /3.140(1.27% RMS)

6 结 论

本文深入分析和研究了 CMOS 图像传感器在 高速数字摄像机中的特点、性能指标和测试原理, 采用不同厂家的两种高帧频 CMOS 图像传感器完 成高帧频相机样机的设计,进行成像性能测试,得 到了在相同测试条件下两种 CMOS 图像传感器的 成像性能参数。该测试结果能够对两种高帧频 CMOS 图像传感器进行客观地对比评价,为设计 高性能高帧频 CMOS 数字摄像机提供参考。

参考文献:

- [1] HOLST G C. Eleectro-optical Imaging System Performance [M]. Bellingham: SPIE Optical Engineering Press 2006.
- [2] HOLST G C. CCD Arrays, Cameras And Displays [M]. 2nd ed. Bellingham: SPIE Optical Engineering Press, 1998.
- [3] JANESICK J R. Photon Transfer: DN→λ [M]. Bellingham: SPIE Optical Engineering Press 2007.
- [4] SUN H H ,CAI R T ,WANG Y J. Design and implementation of high-speed digital CMOS camera driving control timing and data interface [J]. SPIE 2006 6358:63580C.
- [5] HILLEBRAND M. High speed camera system using a CMOS image sensor [C]. Proceedings of the IEEE Intelligent Vehicles Symposium 2000 ,Dearborn ,Mi. USA 3-5 Oct. 2000.
- [6] TIAN H FOWLER B GAMAL A E. Analysis of temporal noise in CMOS APS [J]. SPIE 1999 3649: 177-185.
- [7] 1. 3-megapixel CMOS active-pixel digital image sensor [EB/OL](2004-03-05) / [2011-07-11]. http://wenku. baidu. com/view/0b597a155foe7cd18425364f. html.
- [8] High speed CMOS image sensor [EB/OL] (2007-02-05). [2011-07-11]. http://wenku. baidu. com/view/

	cbae92c7bb4cf7ecc4afed0a5.html.
[9]	范红 陈桂林. CMOS APS 图像传感器的像质分析 [J]. 光学工程 2006 33(5): 104-107.
	FAN H ,CHEN G L. Imaging quality analysis of CMOS active pixel sensor [J]. Opto-electronic Eng. 2006, 33(5):104-
	107. (in Chinese)
[10]	孙宏海 ,李泽学 ,纪华 ,等. 半导体制冷型高帧频 CMOS 数字摄像机研究与成像噪声分析 [J]. 光学 精密工程 ,
	2008 ,16(10) : 2038-2044.
	SUN H H ,LI Z X ,JI H ,et al Study on semiconductor cooling high frame rate CMOS digital camera and its imaging
	noise analysis [J]. Opt. Precision Eng. 2008 ,16(10): 2038-2044. (in Chinese)
[11]	李丹 尚媛园 宋谦.天文用2K×2K 高速 CMOS 相机的研制与测试结果[J].天文研究与技术 2006 3(4):380-
	386.
	LI D SHANG Y Y SONG Q. A 2K × 2K astronomical high-speed CMOS camera and its test result [J]. Astronomical
	<i>Res. Technol.</i> 2006 3(4): 39-42. (in Chinese)
[12]	张娜. 超高速数字 CMOS 图像传感器关键技术研究 [D]. 天津: 天津大学 2008.
	ZHANG N. Rearch on key techniques of super high speed digital CMOS image sensor [D]. Tianjin: Tianjin University
	2008. (in Chinese)
[13]	池国泉. 高性能 CMOS 图像传感器测试与评价系统的设计与实现 [D]. 天津: 天津大学 2008.
	CHI G Q. Design and implement of high performance testing and estimation system for CMOS image sensor [D]. Tianjin:
	Tianjin University 2008. (in Chinese)
[14]	尚媛园 张伟功 宋宇 等 CMOS 成像器件性能测试方法的研究[J] 激光与光电子学进展 2010 47(5):051101.
	SHANG Y Y ZHANG W H SONG Y et al. Research on evaluation method of CMOS image [J]. Laser Optoelectronics
	Progress 2010 47(5):051101. (in Chinese)
[15]	曾桂英 潘金艳.基于 FPGA 的 CMOS 图像传感器采集系统设计 [J].科学技术与工程 2010 3(1):692-695.
	ZENG G Y PAN J Y. Design of the CMOS sensor image acquisition system based on FPGA [J]. Sci. Technol. Eng.
	2010 3(1): 692-695. (in Chinese)
[16]	杨文才 汶德胜 陈淑丹 ,等. 基于高速 CMOS 图像传感器的空间瞬态光探测 [J]. 光子学报 2010 ,39(4):764-768.
	YANG W C , WEN D SH , CHEN SH D et al Spatial transient light detection based on high-speed CMOS image sensor
	[J]. Acta Photonica Sinica 2010 39(4): 764–768. (in Chinese)

作者简介:孙宏海(1980—),男,吉林市人,博士,副研究员,主要从事高帧频数字相机和实时数字图像处理方面的研究。 E-mail: shh426@gmail.com 刘艳滢(1965—),女,吉林长春人,研究员,硕士生导师,主要从事数字图像处理方面的研究。 E-mail: lyyciom@ sohu.com